

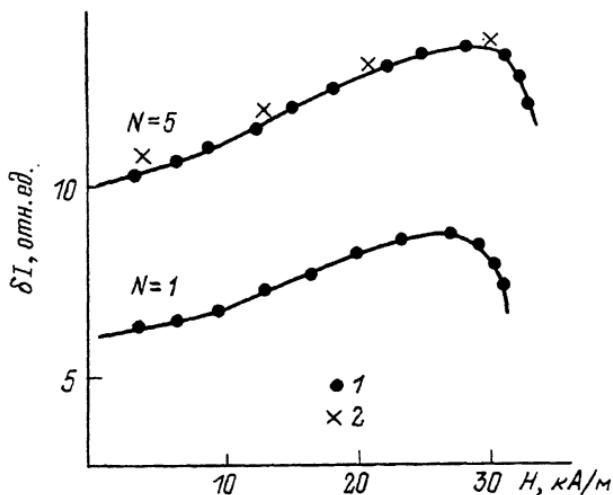
МАГНИТООПТИКА ПАКЕТА ФЕРРИТ-ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК С РЕШЕТКОЙ ЦМД

М.В. Быстров, О.М. Комиссарова,
М.М. Чевинский

Основные магнитные параметры эпитаксиальных феррит-гранатовых пленок, содержащих цилиндрические магнитные домены (ЦМД), обычно определяют, используя магнитооптический эффект Фарадея. Этому благоприятствует высокая магнитооптическая добротность пленок в области длин волн имеющихся источников излучения. При исследовании физики магнитных явлений на субмикронных ЦМД-пленках, в которых угол фарадеевского вращения обычно мал, возникают затруднения. В этом случае приходится повышать чувствительность магнитооптического метода путем усложнения электроники [1], либо использовать другие (обычно интегральные) методы [2].

Возможно усиление фотоотклика за счет собственно эффекта Фарадея. Действительно, при измерениях регистрируется дифференциальный эффект, связанный с перераспределением доменов, а полезный сигнал пропорционален смещению доменных стенок в сечении светового пучка, а также длине оптического пути. Поэтому естественно ожидать некоторого накопления сигнала от нескольких пленок, сложенных вместе. Следует выяснить, насколько велик такой выигрыш и не будет ли он подавлен наложением разнополярных доменов.

Рассмотрим простую магнитооптическую схему, в которой пакет из феррит-гранатовых пленок с пренебрежимо малым магнитным взаимодействием, обладающих решеткой ЦМД одного знака, помещен между поляризатором и анализатором, направления пропускания которых образуют между собой угол Ψ . Плоскость поляризации потока излучения поворачивается в каждой пленке на углы $\pm\varphi$ соответственно в ЦМД и остальной части пленки (матрице). После первой пленки поток распадается на две компоненты, пропорциональные площадям, через которые они проходят (матрицы или ЦМД), отличающиеся знаком фарадеевского угла. После N -слойного образца отдельные компоненты потока будут иметь разные фарадеевские углы, кратные φ , и распределяться уже статистически. Другими словами, поток становится неоднородным по азимуту плоскости поляризации, причем его компоненты образуют веер значений углов поворота, симметричный относительно $\varphi=0$. Можно показать, что такое распределение подчиняется биномиальному закону и для его исчерпывающего описания потребуются всего два параметра: N и α , где α – относительная суммарная площадь доменов одного знака, например ЦМД. Вероятность реализации угла $-\varphi$ при прохождении потоком одной пленки задается величиной α . Нас интересует вероятность реализации любого угла $-k\varphi$ ($k=0.1, \dots, N$) в N -слойном образце, т. е. доля потока, k раз прошедшая через ЦМД. Биномиальное распределение дает искомое выражение:



Фотоотклик одно- и многослойного образца с потерями в зависимости от поля смещения: 1 - эксперимент ($\varphi = 0.5^\circ$, $\psi = 45^\circ$, коэффициент пропускания одной пленки $T=0.8$); 2 - теория (при тех же условиях и пропускании пакета пленок, равном T^N).

$$\rho(-k\varphi) = C_N^k \cdot \alpha^k \cdot (1-\alpha)^{N-k}, \quad (1)$$

где $C_N^k = \frac{N!}{k(N-k)!}$. Легко видеть, что углу $-k\varphi$ отвечает результирующий поворот плоскости поляризации светового потока после образца на угол $\varphi_\Sigma = (N-2k)\varphi$. Таким образом, определенному значению k соответствует единственное значение φ_Σ (и наоборот), причем $\varphi_\Sigma \geq 0$ при $0 \leq k \leq \frac{N}{2}$ и $\varphi_\Sigma \leq 0$ при $\frac{N}{2} \leq k \leq N$. Отсюда следует, что вероятность осуществления φ_Σ должна совпадать с $\rho(-k\varphi)$.

Преобразуем теперь с помощью закона Малюса поляризационные свойства компонент в интенсивностные:

$$I = T^N \cdot \sum_{k=0}^N C_N^k \alpha^k (1-\alpha)^{N-k} \cdot \cos^2 [\varphi - (N-2k)\varphi], \quad (2)$$

где T - коэффициент пропускания одной пленки. Положим, что относительная площадь ЦМД увеличивается под действием смещающего поля на величину Δ . Тогда новое выражение для интенсивности выходящего потока принимает вид:

$$I' = T^N \sum_{k=0}^N C_N^k (\alpha + \Delta)^k (1-\alpha-\Delta)^{N-k} \cdot \cos^2 [\varphi - (N-2k)\varphi]. \quad (3)$$

Интерес представляет разность интенсивностей $\delta I = I' - I$, обусловленная действием магнитного поля. Анализ показывает, что линейный по Δ член в δI пропорционален числу пленок N в пакете. Действительно, для образца в виде одной, двух и трех пленок имеем, ограничиваясь только членами с первыми степенями по Δ ,

$$\delta I_{(1)} \sim \Delta \sin 2\varphi \sin 2\varphi \sim 2\varphi \Delta \sin 2\varphi; \quad \delta I_{(2)} \sim \Delta \sin 2\varphi \sin 4\varphi \sim 4\varphi \Delta \sin 2\varphi;$$

$$\delta I_{(3)} \sim \frac{3}{2} \Delta \sin 2\varphi \sin 4\varphi \cos 2\varphi \sim 6\varphi \Delta \sin 2\varphi.$$

Проверка этого нетривиального вывода для пакета феррит-гранатовых пленок проводилась расчетным и экспериментальным путем. Расчет δI по биномиальному распределению на ЭВМ для $N=10$, $\alpha=0.01$ (гексагональная решетка ЦМД) и $\varphi=0.05^\circ$ показал, что $\delta I_{(10)} / \delta I_{(1)} = 10.08$, причем абсолютный максимум сигнала имеет место при $\psi=45^\circ$. Результаты экспериментального исследования пленок ($Bi, Sm, Lu_3(Ca, Ge, Fe)_5O_{12}$ с $\varphi \approx 0.5^\circ$) и коэффициентом пропускания $T \approx 0.8$ (на длине волн 830 нм) приведены на рисунке. Расхождение с расчетом по биномиальному распределению не превышает 2-3 %. Необходимо подчеркнуть, что выбранный случай является неблагоприятным с точки зрения потерь. Очевидно, что в окне прозрачности ферритов-гранатов будет наблюдаться больший рост фотоотклика для многослойного образца.

Таким образом, впервые рассмотрена магнитооптика многослойного образца с независимой доменной структурой в каждом слое. Показано, что несмотря на пространственную неоднородность выходного потока по азимуту поляризации, интегральный фотоотклик, измеренный по эффекту Фарадея, возрастает пропорционально числу слоев (при малых потрях, когда $T \rightarrow 1$). Важно отметить, что обнаруженная закономерность может быть распространена на пленки с произвольной доменной структурой. На практике многослойный образец будет эффективен в случае использования интенсивного источника излучения, когда измерения на однослоистом образце затруднительны из-за насыщения фотоприемника.

Л и т е р а т у р а

- [1] Smith A., Bekkebrede W., Kestinger M. - Rev. Sci. Instr., 1981, v. 52, N 11, p. 1737-1748.
- [2] Рандошкин В.В., Старостин Ю.В. - Радиоэлектроника за рубежом, М.: НИИЭИР, 1982, в. 18, с. 964.

Всесоюзный научно-исследовательский
институт метрологии
им. Д.И. Менделеева

Поступило в Редакцию
17 июля 1987 г.